

3105.エネルギー分散型X線分析 装置付走査型電子顕微鏡



装置設備名称	エネルギー分散型X線分析装置付走査型電子顕微鏡
メーカー	日本電子(株)
商品名・型式	電界放出形分析走査電子顕微鏡/JSM-7001F
性能・仕様	電子銃：サーマルFE電子銃 2次電子分解能：1.2nm(30kV), 3.0nm(1kV)、電動ステージ(70×50mm) 試料最大高さ：40mm X線検出器：シリコンドリフト検出器 (Be-Uを検出可能)
設備概要・用途	破断面の形状観察や、微小な異物の観察・成分分析、変色域の元素分析、材料の成分分析などが可能です。また、線分析・面分析により、含まれる元素の分布を知ることが可能です。
対象試料	金属, 半導体, セラミックス, プラスチック等 (非導電性の試料の場合、蒸着等の導電性処理が必要になることがあります。)
その他・注意事項	機器利用の場合は、最初に機器講習を受けていただきます。